附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 计划下达文号及编号 | 项目名称 | 起草单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国标委发[2018]60号20181810-T-469 | [砷化镓单晶](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=113383&stage=plan) | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科[2018]73号2018-2075T-YS | 高纯锗粉 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-001-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范 区熔锗锭 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-002-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范 碳化硅单晶抛光片 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2019]17号2019-003-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉体 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]6号20200799-T-469 | 碳化硅单晶抛光片 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]37号20202826-T-469 | 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2019]40号20194171-T-469 | 高纯锑 | 峨眉山市峨半高纯材料有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2019]40号20194175-T-469 | 磷化镓单晶 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2020]6号20200798-T-469 | 磷化铟单晶 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2020]37号20202882-T-469 | 金属锗化学分析方法 第3部分：痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 广东先导稀材股份有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2019]126号[2019-0171T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT03012019) | 镓镁合金 | 南京金美镓业有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2019]126号[2019-0172T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT03022019) | 铟镁合金 | 南京金美镓业有限公司 | 讨论 |
|  | 中色协科字[2020]8号2020-024-T/CNIA | 氮化硅造粒粉 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 讨论 |